

Miernik grubości powłok TE

Producent: Sauter



- sonda na przewodzie
- płytki zerowa i folie kalibracyjne w zestawie
- miernik dostarczany w walizce
- funkcja kalibracji dwupunktowej pozwala uzyskać dokładność ok. 1% wartości mierzonej.
- wybór jednostek: μm , inch (mil)
- funkcja automatycznego wyłączenia

Dane techniczne:

Model	TE 1250-0,1F	TE 1250-0,1N	TE 1250-0,1FN
Zakres pomiarowy	0-1250 μm		
Rozdzielczość [μm]	0,1μm < 100μm; 1μm > 100μm		
Dokładność	standardowo: 3 % pomiaru lub ± 2,5μm; po kalibracji dwupunktowej: 1 % pomiaru lub ± 1,0μm		
Rodzaj podłoża	magnetyczne	niemagnetyczne	magnetyczne i niemagnetyczne
Min. promień zakrzywienia powierzchni	wypukły 1,5 mm, wklęsły 25 mm	wypukły 3 mm, wklęsły 50 mm	
Temperatura pracy	0°C - 50°C		
Zasilanie	4 x 1.5 V AAA		
Wyświetlacz	LCD		
Jednostki	μm, inch (mil)		
Wymiary obudowy	131 x 65 x 28 mm		
Obudowa	plastik		
Wymiary opakowania	250 x 210 x 53 mm		
Waga brutto	0,75 kg		
Waga netto	0,08 kg		
W zestawie	miernik z bateriami, walizka, płytki zerowa, folie wzorcowe, instrukcja obsługi		
Na życzenie	certyfikat kalibracji ISO		

Opcje:

Model		Opis
ATB-US07		Folie kalibracyjne do miernika grubości powłok (5 szt.)
ATC-01		Oprogramowanie do przesyłania danych do TC, TE, TF, TG
AFH 12		Konwerter przewód (z RS-232 na USB)